Sear	ch No	tes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/790,029	NOSAKA ET AL.
Examiner	Art Unit

3679

Aaron M. Dunwoody

•	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
updated	search	11/24/2007	AMD

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	1		

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
•		
		-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	,	
,		
		<u> </u>